極端小口径の高密度ヘリコンプラズマ特性

中川 叔紀* 藤墳 弘昌 佐藤 慶武 田中 瑛子 桑原 大介 篠原 俊二郎 (東京農工大学)

1. 諸言

電気推進ロケットエンジン^{[11}は,化学ロケットエンジン と比べて比推力において非常に優れているため,深宇宙探 査など宇宙空間での長期ミッションへの運用が期待され ている.しかし,現在使用されているエンジンは,電極が プラズマと直接接触するため損耗が起こり,寿命が制限さ れる問題を抱えている.そこで本研究室では,プラズマと 接触のない外部アンテナから高密度プラズマの励起を可 能なヘリコンプラズマ^[2-5]を用いて,完全無電極構造のエン ジンの開発を目指している.

2. 研究目的

一般的には大きい推力を得るために大型大電力の推進 機を用いる研究が主にされているが、本研究では小型の推 進装置の研究を行っている.小型の推進機の開発によって、 小型・軽量を生かした姿勢制御などの小回りの必要な推進 機としての運用や、複数の推進機をクラスタ化させること による冗長性の獲得、また推進以外の目的でも、電気推進 ロケットエンジンの中和器に用いる小型高密度プラズマ 源や細管の内壁加工などのメリットが期待されている.

本研究では、本研究室で開発した小ヘリコン装置^[6,7] (Small Helicon Device: SHD)を用いて,以下の事を行った.

- 従来の最小径 20 mm^[6,8]以下の極端小口径でのプラズ
 マ放電を行いプラズマ特性を比較
- ② 推進機としての性能評価およびガス種依存性調査の 初期実験として、ArとHeの2種類のガスを用いて電 子密度と流速の計測・比較

3. ヘリコンプラズマ

ヘリコンプラズマ^[9]とは、ヘリコン波によって励起され るプラズマのことであり、この波は管壁などによって境界 を持つホイッスラー波(磁場に平行に進む右回りの円偏波) である.1 Pa以下の低圧力下でも高密度(~10¹³ cm⁻³)生 成が可能であり、圧力や磁場強度、高周波電力(radio frequency: rf)周波数などで広い運転領域を持つ特徴がある. 具体的な生成機構については精力的に研究が行われてお り、ヘリコン波から TG 波 (Trivelpiece-Gould wave) への モード変換による吸収過程が有力である.

Fig. 1にヘリコンプラズマの分散関係を示す. 電子密度 *n*eと波数 *k*//が一定と仮定すれば, プラズマ径が小さいほど rf 周波数と磁場強度の比 *f*/*B* は大きくなる, すなわち小口 径ヘリコンプラズマ生成には高い rf 周波数と低い磁場強 度が適していると考えられる.



Fig. 1 Dispersion relation of helicon plasma.^[9]

4. 実験装置

実験に使用した小ヘリコン装置の概略図を Fig. 2 に示す. 生成されたプラズマが噴射される真空チャンバー部は全 長 865 mm,内径 165 mm と、本研究室のもう一つのプラズ マ生成装置 Large Mirror Device (LMD^[10],全長 1,700 mm, 内径 450 mm)よりも小さい設計となっている.このチャ ンバーに石英管を接続し、プラズマを生成する.ゲージポ ートアダプタによって接続する石英管の内径と形状は自 由に変えることができ,今回の実験では内径 20 mm, 10 mm, 5 mm, 3 mm で,長さはいずれも 453 mm のものを使用し た.プラズマ生成アンテナには厚さ 0.2 mm の銅板で作成 したダブルループアンテナを,外部磁場の印加には自作の コイル (幅 100 mm,内径 94 mm,外径 360 mm,最大軸方 向磁場強度 28 G/A)を使用した.プラズマの電子密度と流 速の計測にはそれぞれ自作のラングミュアプローブとマ ッハプローブ^[11]を使用した.



Fig. 2 Small Helicon Device (SHD).

5. 実験結果

5.1 小口径プラズマ放電

rf アンテナ直下 (z=-265 mm) における内径 20 mm での 各周波数の電子密度 n_e のrfパワー P_{rf} に対する依存性をFig. 3 に示す.ガス流量は 20 sccm (ガス圧約 1.8 Pa), コイル 電流 *I* は 20 A で一定とした.rf 周波数 *f*=7, 50, 70 MHz, 外部磁場の有無いずれの場合でも n_e は P_{rf} に対して増加し た.7 MHz のとき rf パワー P_{rf} ~ 800 W で急激な n_e の上昇 (密度ジャンプ) が起こり,1 kW で n_e ~ 10¹³ cm⁻³が得られ た.これは ICP (Inductively Coupled Plasma: 誘導性結合型 プラズマ) からヘリコンプラズマへ放電モードが移行した ものと考えられる.^[12] *f*=50, 70 MHz の場合は,600 W まで は7 MHz の場合よりも高い n_e を示したが,急激な密度ジ ャンプは見られなかった.

しかし Fig. 4 において, 50, 70 MHz では 7 MHz よりも低 パワーでのプラズマ放電が可能であり,最小で約 1 W での 生成が確認された. 50 MHz では 7 W, 70 MHz では 2 W 前 後で 10^8 cm⁻³ から 10^{10} cm⁻³ への密度ジャンプが見られた. これは, CCP (Capacitively Coupled Plasma: 容量性結合型 プラズマ)から ICP へ放電モードの移行と考えられる.



Fig. 3 n_e (z = -265 mm) as a function of $P_{\rm rf}$ with inner diameter of 20 mm ($P_{\rm rf} = 0 - 1200$ W).



Fig. 4. n_e (z = -265 mm) as a function of $P_{\rm rf}$ in inner diameter of 20 mm ($P_{\rm rf}$ = 0 –15W).

石英管内径 10 mm の場合の電子密度の rf パワー依存性 を Figs. 5 と 6 に示す. 測定位置は Fig. 5 が z = 65 mm (真 空チャンバー内), Fig. 6 が z = -40 mm (石英管内) である. ガス流量は 5 sccm (ガス圧 約 1.6 Pa) とした. P_{rf} と共に n_e は上昇し, f = 12 MHz, I = 20 A の場合は密度ジャンプも 得られた. 石英管内で $n_e \sim 10^{12}$ cm⁻³, 真空チャンバー内で $n_e \sim 10^{11}$ cm⁻³が得られた.



Fig. 5 n_e (z = -40 mm) as a function of $P_{\rm rf}$ with 10 mm i.d..



Fig. 6. n_e (z = 65 mm) as a function of $P_{\rm rf}$ with 10 mm i.d.

更なる小型高密度プラズマ源の開発のため, 石英管内径 5mm での高密度プラズマの生成を試み、放電に成功した。 ラングミュアプローブが放電を阻害するため石英管内に 挿入出来ず,計測位置は真空チャンバー内(z=65 mm)の みとした. 電子密度のrfパワー依存性をFig.7に示す. ガ ス流量は5 sccm (ガス圧約60 Pa)とした.内径10 mm で は真空チャンバー内で neは 10¹¹ cm⁻³,石英管内で 10¹² cm⁻³ を得られ、5 mm においても石英管外で ne~ 10¹¹ cm⁻³が得 られていたことから、石英管内の ne は約 10¹² cm-3 と推定で きる. また, 生成されたプラズマがヘリコンプラズマであ るかどうかの確認が必要だが、磁化 ICP としては従来の内 径 20 mm よりも小さい世界最小径のものである. 内径 3 mm でもプラズマの放電にも成功した (Fig. 8, rf 周波数 70 MHz, ガス流量 0.04 sccm, P_{rf} ~ 650 W). プラズマが真空 チャンバーに届かなかったため, n. の計測は出来なかった. しかし、分光器によって Ar のスペクトルは観測できた.



Fig. 7 $n_e (z = 65 \text{ mm})$ as a function of P_{rf} with 5 mm i.d., changing *I*.





5.2 電子密度とイオン流速のガス種依存性

石英管内径 20 mm で Ar を用いた場合の電子密度と流速 $v \text{ or } \mathbf{f} \land \nabla \neg \mathbf{k}$ 存性を計測した.石英管内径は 20 mm, rf 周波数は 12 MHz,計測位置は z = 95 mm (コイル直下) と した. $P_{rf} \sim 300$ W で 10^{10} cm⁻³ から 10^{11} cm⁻³ $\sim on_e o$ ジャ ンプが見られ,同時に流速は約 1,300 m/s から約 600 m/s に 低下した.密度ジャンプが起こった後は rf パワーに比例し て電子密度は上昇したが,流速はほとんど変化しなかった.

次に、ガス種を He に変えて同様の実験を行い、電子密度 n_e と流速の rf パワー P_{rf} に対する依存性を計測した。発光の様子を Fig.9 に示す。Ar での放電と比べて電子密度が低く、プラズマの発光も弱かった。これは、Table 1 にあるように、He が Ar と比べて約 1.4 倍の第一イオン化エネルを持つため、同じ rf パワーでも電離度が低くなたことが原因と考えられる。マッハプローブによるイオン流速の計測に関しては、コイル電流 20 A で最大値約 3,700 m/s と Ar ガスの 3 倍近い速度を得た。これは、Table 1 より、He の質量が Ar の約 0.1 倍と非常に軽いことが原因と考えられる。



Fig. 9 Discharge with i.d. of 20 mm using He gas.

Table 1 Molecular weight and First ionization energy

ガス種	H2	He	Ar	Xe
分子量[g/mol]	2.016	4.003	39.95	131.3
第一イオン化	13.60	24.59	15.76	12.13
エネルギー[eV]				

6. 結論と今後の課題

6.1 小型プラズマ源の開発

小口径高密度プラズマ源の開発を目的として,従来の最 小径 20 mm^[6,8]以下の内径でプラズマ生成を試みた.

実験の結果,以下のことが分かった.

- ・内径 20 mm, rf 周波数 7 MHz で電子密度 10¹³ cm⁻³ 達成.
- ・rf 周波数が高いほど低パワー領域で高密度,高パワー領 域では逆の傾向
- 50,70 MHz では5W以下の低パワーでもプラズマ生成が可能(電子密度10¹⁰ cm⁻³)
- ・磁化 ICP としては世界最小径の5 mm での放電と電子密度の計測に成功(電子密度 10¹¹ cm⁻³)
- ・内径3mmでのプラズマ放電に成功

本実験では、内径3mmでの放電には成功したが、プロ ーブが挿入できず電子密度の計測が出来なかったこと、生 成されたプラズマがICPかへリコンプラズマかの判別が出 来なかったことが今後の課題として残った.更なる小口径 高密度プラズマ源の開発も考慮に入れて、今後の予定として以下のことを行っていく.

- ・内径3mmでの電子密度の計測
- ・内径1mm でのプラズマ放電
- Intensity Ratio の測定による電子密度とイオン温度の計測
- ・波動の計測による ICP とヘリコンプラズマの判別

6.2 推進性能の評価

小型高密度プラズマ源の推進装置としての性能評価と He 放電の初期実験として, Ar と He の 2 種類のガス種でプ ラズマを生成し、推力に関わる重要なパラメータである流 速をマッハプローブによって計測してそれぞれを比較し た.その結果,下記のことが分かった.

- ・マッハプローブを用いて内径 20 mm でのプラズマ 流速の計測に成功
- Ar 放電で rf パワー200 W で流速約 1,300 m/s. 300
 W 付近で 10 倍程度の電子密度のジャンプ. 同時に 流速が 600 m/s まで減速
- ・He でのプラズマ放電に成功. 電子密度 10¹¹ cm⁻³, 流速 3,700 m/s
- ・Ar 放電と比べて, He 放電は低い電子密度, 高い流速 He 放電および流速の計測に成功はしたが, マッハプロ

ーブはプラズマに電極を挿入し計測を行うためにプラズ マを乱し、加えて高周波ノイズの大きい石英管内では大き な誤差を出してしまう可能性がある.推進装置としてのさ らなる評価も考慮して、今後は下記のことを行っていく.

- ・He 放電の高密度化
- ・磁場配位の調整や永久磁石の使用による流速の増加
- ・流速と電子密度の軸方向分布の計測による推力の算出
- ・H₂, Xeの放電とパラメータ計測
- ・レーザー誘起蛍光法による流速の絶対計測

参考文献

- 栗木恭一・荒川義博: 電気推進ロケット入門, 東京大 学出版会 (2003).
- [2] R. W. Boswell : Phys Lett. **33A** (1970) 457.
- [3] S. Shinohara : Jpn. J. Appl. Phys. 36 (1997) 4695.
- [4] R. W. Boswell and F. F. Chen : IEEE Trans. Plasma Sci. 25 (1997) 1229.
- [5] F. F. Chen and R. W. Boswell : IEEE Trans. Plasma Sci. 25 (1997) 1245.
- [6] D. Kuwahara, A. Mishio, T. Nakagawa and S. Shinohara: Rev. Sci. Instrum. 84 (2013) 103502.
- [7] T. Nakagawa, S. Shinohara, D. Kuwahara, A. Mishio and H. Fujitsuka: J. Phys. Soc. Jpn. Suppl. 83 (2014) in press.
- [8] O. V. Batishchev: IEEE Trans. Plasma Sci. 37 (2009)

1570.

- [9] 篠原俊二郎, 日本物理学会誌 64 (2009) 519.
- [10] S. Shinohara, S. Takechi and Y. Kawai: Jpn. J. Appl. Phys. **35** (1996) 4503.
- [11] プラズマ・核融合学会編, プラズマ診断の基礎, 名古 屋大学出版会 (1990).
- [12] S. Shinohara, T. Hada, T. Motomura, K. Tanaka, T. Tanikawa, K. Toki, Y. Tanaka and K. P. Shamrai : Phys. Plasmas 16 (2009) 057104.